

Лекция 11. Многомерные базисы вейвлетов с параметром сжатия 2

Рассмотрим обобщение вейвлет-анализа на двумерный случай. Определим кратномасштабный анализ. Пусть пространство V_0 определяется как

$V_0 = \text{span}\{F(x, y) = f(x)g(y), f(x) \in V_0, g(y) \in V_0\}$. Требуется определить пространство W_0 .

Исходим из определения кратномасштабного анализа.

$$\begin{aligned}V_{j-1} &= V_{j-1} \otimes V_{j-1} = (V_j \oplus W_j) \otimes (V_j \oplus W_j) = (V_j \otimes W_j) \oplus (W_j \otimes V_j) \oplus (V_j \otimes V_j) \oplus (W_j \otimes W_j) = \\&= V_{j-1} \oplus W_{j-1},\end{aligned}$$

Т.е. согласно обозначениям, необходимо, чтобы детализирующее пространство было образовано как $W_j = (V_j \otimes W_j) \oplus (W_j \otimes V_j) \oplus (W_j \otimes W_j)$

Таким образом, правила масштабирования переносятся на двумерный случай в следующем виде:

Базисом детализирующего пространства является линейная оболочка функций

$\varphi^{zop} = \varphi(x)\psi(y)$ - хорошо передает горизонтальные особенности изображения

$\varphi^{sep} = \psi(x)\varphi(y)$ - хорошо передает вертикальные особенности изображения

$\varphi^{diag} = \psi(x)\psi(y)$ - хорошо передает диагональные особенности изображения

Улучшение показателя сжатия вейвлетов

Для большинство сжимаемых сигналов улучшение показателя сжимаемости достигается, если аппроксимирующие вейвлеты обладают большей гладкостью. А рассмотренные нами до сих пор вейвлеты не отличались хорошей гладкостью.

Улучшения гладкости удается добиться за счет введения *койфлетов*.

Мы знаем, что гладкость вейвлета связана со значениями моментов

$\int x^l \psi(x) dx, \int x^l \varphi(x) dx$ Мы не можем требовать, чтобы $\int \varphi(x) dx = 0$, но можно потребовать, чтобы $\int x^l \varphi(x) dx = 0$, для $l > 0$. Это условие обеспечит хорошую гладкость производных вейвлета, что в свою очередь должна улучшить показатели сжатия.